



Instrumento de control de calidad

## X-Rite Ci™52

Espectrofotómetro de mesa

Instrumento flexible para la medición consistente del color de una amplia variedad de muestras en un rango de materiales, tamaños, formas, texturas y niveles de opacidad. La medición simultánea del color y de la apariencia mejora la precisión. Un sistema compatible con NetProfiler3 garantiza un desempeño consistente y preciso.



# Especificaciones del espectrofotómetro X-Rite Color i52

## Ventajas de X-Rite Color i52

**Versátil.** Contempla finalidades de uso portátil o de mesa; la tecla de lectura remota proporciona conveniencia

**Fácil de usar.** Operación del tipo cerrar y accionar respaldada por indicadores de estado visual (LED) y acústico

**Integralidad de medición mejorada.** Una base con mira del tipo pivotante con amortiguamiento y la activación remota de las mediciones facilitan medir muestras difíciles de manejar.

**Acepta una amplia gama de muestras y tamaños.** Capacidad de medición de materiales con 14 mm o más tales como papel, plástico, textiles y una variedad de superficies duras

**Lecturas rápidas y precisas.** Tiempo de medición de 2 segundos en muestras planas estándares así como con formas complejas

**Desempeño confiable.** Medición simultánea del componente especular incluido (color) y excluido (apariencia) para determinar la influencia correspondiente

**Mediciones consistentes.** La superior correlación asegura la integridad del control de color respecto a múltiples instrumentos

**Compatible con NetProfiler®3.** Sistema incorporado optimiza el desempeño del instrumento y permite la certificación a distancia

**Transición sin tropiezos.** Opera de acuerdo con los espectrofotómetros X-Rite SP64, SP62 y SP60

<b>Geometría de medición</b>	d/8°, mecanismo espectral DRS,
<b>Abertura de medición:</b>	Área de medición de 8 mm Ventanilla de objetivo de 14 mm
<b>Fuente de luz</b>	Lámpara a gas tungsteno
<b>Receptor</b>	Fotodiodos azules de silicóna
<b>Rango espectral</b>	400 – 700 nm
<b>Intervalo espectral</b>	10 nm – medición 10 nm – salida
<b>Rango de medición</b>	0 a 200% reflectancia
<b>Tiempo de medición</b>	Aprox. 2 segundos
<b>Compatibilidad entre instrumentos</b>	CIE L*a*b*:  Promedio 0.30 ΔE*ab, basado en el promedio de 12 cerámicas BCRA series II (componente especular incluido)  0.50 ΔE*ab máximo en una cerámica cualquier (componente especular incluido)  0.05 ΔE*ab en cerámica blanca
<b>Repetibilidad a corto plazo</b>	
<b>Compatibilidad con NetProfiler incorporada</b>	
<b>Duración de lámpara</b>	500.000 mediciones, aprox.
<b>Fuente de alimentación</b>	Requisitos del adaptador de CA 90 - 130 V AC o 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz, 15 W máx.
<b>Interfaz de datos</b>	USB
<b>Rango de temperatura operacional</b>	50° F a 104° F (10° C a 40° C) 85% humedad máxima relativa (sin-condensación)
<b>Rango de temperatura de almacenamiento</b>	-4° F a 122° F (-20° C a 50° C)
<b>Peso</b>	1.9 lbs. (0.87 kg)
<b>Dimensiones</b>	10,9 cm (4.3") alto x 9,1 cm (3.6") ancho x 21,3 cm (8.4") largo (10.9 cm 8.4 cm 19.6 cm)
<b>Accesorios incluidos</b>	Estándares de calibración (colector negro, estándar blanco extraíble), manual de uso, adaptador de CA, cable USB con dispositivo anti-tracción
<b>Opciones</b>	Soporte para mesa opcional accesorios para presentación de muestras



### X-RITE WORLD HEADQUARTERS

Grand Rapids, Michigan USA • (800) 248-9748 • +1 616 803-2100 • xrite.com

©2011, X-Rite, Incorporated. All rights reserved. L10-447-PaintES (05/11)

